

現行ビームライン・キーワードとの対応表 (1/2)

大分類	小分類		現行の共用、理研ビームライン (専用BL)	関連キーワード
分光	A1	汎用・自動XAFS	01B1, 14B2, 32B2	汎用XAFS、自動XAFS、局所構造、化学状態、オペランド
	A2	X線発光分光/HERFD-XAFS/X線ラマン散乱	39XU, 36XU (12 XU)	高感度化学状態分析、微量元素分析、X線ラマン散乱、RIXS
	A3	XAFS-CT	36XU, 37XU, 39XU, 29XU	オペランド計測、化学状態可視化、投影型、結像型、高速走査型
	A4	蛍光X線・XMCDイメージング	37XU, 29XU, 39XU	化学状態・微細組織可視化、元素分布
	A5	高速XAFS	36XU	qXAFS、複合計測、化学状態可視化、オペランド
HAXPES	B1	汎用・自動HAXPES	09XU, 46XU	電子状態、化学状態、共鳴HAXPES、3次元空間分解計測
	B2	雰囲気制御HAXPES	09XU, 46XU	電子状態、オペランド、大気圧
高分解能分光	C1	磁気・高分解能コンプトン散乱	08W	電子軌道状態、フェルミ面、スピン状態
	C2	核共鳴散乱	35XU, 19LXU	核共鳴振動分光、酵素活性中心、元素選択性、エネルギー領域放射光メスバウアー分光、時間領域干渉法、スローダイナミクス
	C3	非弾性散乱 (IXS)	35XU, 43LXU	ダイナミクス、熱伝導率、フォノン、コンプレックスマテリアル、不規則系、地球内部物質科学、弾性波速度
	C4	蛍光X線ホログラフィ		3次元原子像可視化
	C5	コンプトン散乱イメージング	08W, 05XU	オペランド観察、デジタルツイン

現行ビームライン・キーワードとの対応表 (2/2)

大分類	小分類		現行の共用、理研ビームライン (専用BL)	関連キーワード
回折・散乱	D1	多目的XRD (多軸回折計)	13XU, 19B2	多軸回折計、その場観察、オペランド測定、マッピング測定、カスタマイズ
	D2	粉末XRD	13XU, 02B2, 19B2, 44B2	自動測定、オペランド観察、結晶構造解析
	D3	PDF	13XU, 04B2, 08W, 44B2	ハイスループットPDF, その場PDF、局所構造・高速測定
	D4	単結晶XRD	02B1, 40XU	精密構造解析、ハイスループット
	D5	ナノビームXRD/X線トポグラフィ	13XU, 32B2, 29XU	格子歪分析、マッピング測定、X線トポグラフィ
	D6	XRDイメージング/3DXRD	47XU, 05XU	グレイン、方位マッピング、オペランド
	D7	高圧力環境下・超極限環境下XRD	10XU, 04B1, 05XU	ハイスループットDAC-XRD、高圧物性、マイクロXRD、大容量プレス、地球惑星ダイナミクス、極端環境測定
小角散乱	E1	汎用・自動SAXS	19B2, 40XU, 40B2, 05XU	SAXS、USAXS、GI-SAXS、自動測定、オペランド測定
	E2	イメージングSAXS	40XU, 40B2	局所構造解析、散乱CT、散乱イメージング同時計測
	E3	高速SAXS、XPCS	40XU, 29XU	不均一性評価、ダイナミクス解析、in-situ、in-vivo
軟X線関連	F1	軟X線XAFS	27SU, 17SU	軟X線MCD、大気圧測定
	F2	軟X線光電子分光・ARPES	25SU	マイクロビーム、空間分解測定
	F3	軟X線イメージング (PEEM/STXM)	17SU, 25SU	分光イメージング、PEEM、SPELEEM、ナノビーム
イメージング	G1	汎用・自動CT	20B2, 28B2, 05XU	自動CT、まるごとCT、オペランドCT、マイクロCT
	G2	ナノCT/タイコグラフィ	20XU, 47XU, 29XU	マルチスケールCT
	G3	高速イメージング・CT	47XU, 20XU, 20B2, 05XU	オペランドCT、超高速撮影
タンパク質 構造解析	H1	結晶構造解析(単結晶回折計)	45XU, 32XU, 41XU, 26B1	自動測定
	H2	相関構造解析	45XU, 32XU, 41XU, 26B1, Cryo-EM	単粒子解析、性状評価、試料調製、Cryo-TEM
	H3	BioSAXS	40B2, 38B2	SEC-SAXS、動的解析
	H4	動的結晶構造解析・室温測定	41XU, 32XU, 45XU, 26B1	時分割測定、構造多型、シリアル結晶構造解析